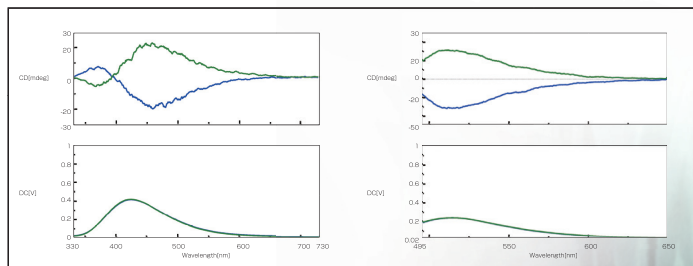


励起分子のキラリティーを判定し、 3D 構造解析に必要な情報を提供します。

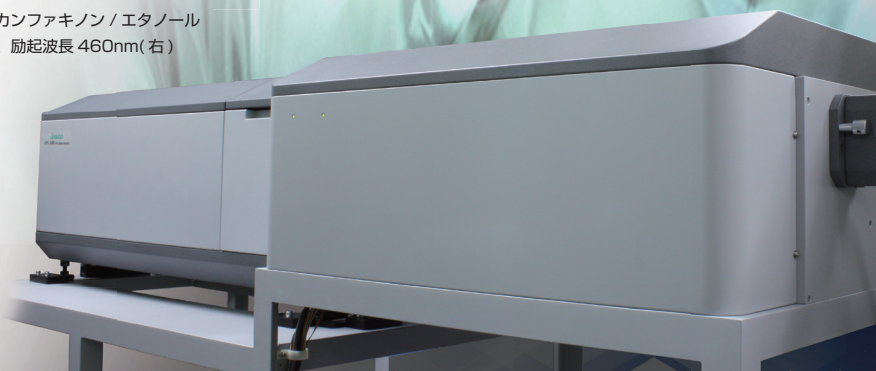
- ・ 励起・発光の双方にモノクロメーターを採用し、対象分子に最適化された波長選択を実現
- ・ プリズム分光により、250 nm の紫外域から広い波長範囲でアーティファクトの少ない CPL 測定
- ・ ロックイン検出による低ノイズ測定
- ・ 円二色性分散計 J-1000 シリーズと共通した付属品群により温度変化測定や磁場中での測定が可能



カンファ / エタノール カンファキノ / エタノール
上 : CPL 下 : 蛍光 励起波長 291nm(左)、励起波長 460nm(右)

円偏光ルミネッセンス測定システム

CPL-300



CPL の開発・製造に 45 年以上

日本分光は 1977 年より CPL 測定装置の開発に携わっています。

1977

CPL 基礎技術の開発：
発光中の円偏光含有率
測定装置，
(特許第 875974 号：
権利消滅済)

1981

第 1 号機完成

2002

CPL-200 円偏光
ルミネッセンス測
定装置上市

2014

CPL-300
上市

2024

第 20 回
光化学協会
技術賞



光と技術で未来を見つめる

日本分光

日本分光株式会社

〒192-8537 東京都八王子市石川町2967-5
TEL 042(646)4111(代)

日本分光の最新情報はこちらから

<https://www.jasco.co.jp>

日本分光HP



JASCO

JASCO は日本分光株式会社の登録商標です。
本広告に記載されている装置の外観および仕様は、
改善のため予告なく変更することがあります。